## 水素プラズマ支援パルスレーザ堆積法による BaO 薄膜の成膜 Growth of BaO thin film by hydrogen plasma assisted pulsed laser deposition method

○小林 将大<sup>1</sup>, 大室 聡<sup>2</sup>, 胡桃 聡<sup>3</sup>, 松田 健一<sup>3</sup>, 鈴木 薫<sup>3</sup> <sup>\*</sup>Masahiro Kobayashi<sup>1</sup>, Satoshi Oomuro<sup>2</sup>, Satoshi Kurumi<sup>3</sup>, Kenichi Matsuda<sup>3</sup>, Kaoru Suzuki<sup>3</sup>

Abstract: In this study, we have tried to remove the oxygen from BaO targets by off-axis Hydrogen Plasma Assisted PLD(HPA-PLD). As a result, high  $Ba^+$  peaks of 454 nm, 553 nm, 577nm and 707 nm were observed both non-assisted and hydrogen plasma assisted. Moreover, high O peaks of 501 nm and 509 nm and 512nm were observed by the addition of hydrogen plasma assisted. Towards the off-axis(2.95 $\mu$ m) becomes smaller and uniform particle size than on-axis(0.70 $\mu$ m).

1. はじめに

現在の発電電力の 4.8%は送電線の電気抵抗によっ て失われている。これは年間約 480 億 kWh の損失と 同じであり,原子炉約6基分の発電電力量に相当す る。そのため、低消費エネルギーである鉄系超伝導 体が必要である。しかし,超伝導体は多元素物質で あるために結晶化や薄膜が困難である。そのために 材料に単元素を用いるのが良い。しかし、材料が高 価であり、酸化するなど取り扱いが困難である。こ の問題を解決するため我々は、水素プラズマ支援パ ルスレーザ堆積法に注目した。まず、パルスレーザ 堆積法では、メリットとしては、ターゲット組成と 膜組成のズレが少ないことがある。デメリットとし ては、ターゲットバルクの破片などのクラスターに より薄膜の均一性・平滑性が損なわれる。on-axis は 基板とターゲットが平行になる。off-axis はターゲッ トと基板が垂直になる。メリットとしては、クラス ターの影響が受けにくいということがある。また、 水素プラズマアシストを使用するとアブレーション プルム中の酸素が水素と反応することにより酸素除 去が期待できる。

2. 実験方法

Fig. 1 は(a)on-axisHPA-PLD,(b)off-axisHPA-PLDの装 置図を示す。BaO に集光した Nd:YAG レーザ(LOTIS TEELS2147,波長:355nm,パルス幅:20ns,周波数:10Hz, レーザフルエンス 8.8J/cm<sup>2</sup>)を 30 分間照射して,SiO<sub>2</sub> 基板(10×10×1mm)上に堆積させた。BaO ターゲット は BaO 粉末(ALDRICH,純度 90%)を 30 分間,70kN で圧縮形成したものを用いたものを用いた。ターゲッ ト基板間距離 40mm(on-axis),20×20mm(off-axis)とした。 水素プラズマを fig. 1 のようにアブレーションプルム に吹き付ける。アブレーションプルムはレーザをター ゲットに照射することによって得ることができる。今 回は、どのような設置条件により成膜が良くできるの か on-axis,off-axis や水素プラズマを入れたりするなど 4つの条件で実験をする。on-axis は基板とターゲット を平行にし, off-axis は基板とターゲットが垂直に設置 をする。評価方法としては CCD 分光器(StellaNet, EPP2000C-50)による ICP の発光スペクトル, アブレー ションプルムの発光スペクトル測定及び走査型電子顕 微鏡 (Scanning Electron Microscope : SEM, Hitachi High Technologies, S-3000N) による薄膜の表面観察を行う。 詳しい条件は table 1 に示す。



| 配置       | 雰囲気圧<br>[Pa] | 基板間距離<br>[mm]  | 流量<br>[sccm] |
|----------|--------------|----------------|--------------|
| on-axis  | 0.01         | 40             | 0            |
| on-axis  | 0.01         | 40             | 250          |
| off-axis | 0.01         | 20 × 20        | 0            |
| off-axis | 0.01         | $20 \times 20$ | 250          |

講演者の所属 1:日大理工・学部・電気 2:日大理工・院(前)・電気 3:日大理工・教員・電気





Fig. 3アブレーションプルムの発光スペクトル







(c) off-axis

## Fig. 4 SEM 像

Fig.2において水素の発光スペクトルを示す。水素の発 光を見ると波長が 486nm, 656nm において水素のピー クが出てきていることが分かる。よって、水素プラズ マの生成が出来たと考えられる。また、水素以外のピ ークが出てきてしまっているのは、 チャンバー内が真 空になりきれていなかったので大気がプラズマに変わ ったと考えられる。

Fig. 3 においてアブレーションプルムの発光スペク トルを示す。アブレーションプルムの発光スペクトル を見ると波長が Ba<sup>+</sup>: 454, 553, 577, 707 nm と Ba<sup>2+</sup>: 496, 585,614,649 nm となる。また,水素プラズマを加える と酸素のピークが出たと考えられる(O:501, 509, 512 nm)。これは、アブレーションプルム内で酸素と反応 があったからだと考えられる。



Table 2 粒径の大きさ

| On-axis | On-axis  | Off-axis | Off-axis |
|---------|----------|----------|----------|
|         | H plasma |          | H plasma |
| 2.95µm  | 4.23µm   | 0.70µm   | 0.84µm   |

Fig. 4とFig. 5においてon-axis,off-axisのSEM像とドロ ップレットの比較を示す。薄膜のSEM画像においては, off-axisの方がon-axisよりも粒径が均一かつ小さくなる ことが分かった。また、ドロップレットの幅もoff-axis の方が狭くなっていることが分かる。

## 4. まとめ

水素ICPの分光スペクトルから水素以外のピークも 出現していることが分かる。また、水素プラズマを加 えるとアブレーションプルムの発光スペクトルに酸素 のピークが出現していることが分かる。Off-axisの方が 粒径が均一かつ小さくなることが分かる。

## 参考文献

- [1] Y. Kamihara, et al: JACS, pp. 10012-10013 (2006).
- [2] S. Lee, et al: Nature Materials, Vol. 9, No. 5, pp. 397-402 (2010).
- [3] 亀谷文健: 平 22 日本金属学会誌, 第 74 巻第 7 号 pp. 444-452.
  - [4] A. N. ZaideV et al: IFI/PLENUM, pp. 376-377 (1970)